

# ミットヨ ISO/IEC 17025 (JCSS) 登録状況リスト

QA-E130032 Rev.32.0  
2020-07-22 作成  
株式会社ミットヨ  
品質保証部

[校正区分]

1. 長さ

種類	種類	校正の範囲	認定番号	初回認定日	備考	
計量標準 キャリブレーション課	波長計量器	633 nm 領域の波長	0067	2017-04-28	-	
		532 nm 領域の波長				
宮崎工場	ブロックゲージ	0.1 mm 以上 1000 mm 以下	0030	1994-05-02	光波干渉測定 比較測定	
		各種長さ測定用校正器で 測定面が平面であるもの		1 mm 超 2010 mm 以下	2005-04-20	光波干渉測定
	1 mm 以下			2018-06-21		
	宇都宮 キャリブレーション センタ	標準尺		1000 mm 以下	0031	1996-08-07
ブロックゲージ		500 mm 超 1000 mm 以下	2003-03-25	光波干渉測定		
		0.5 mm 以上 600 mm 以下	1998-05-06	比較測定		
各種長さ測定用校正器で 測定面が平面であるもの		2100 mm 以下	2003-03-25	光波干渉測定		
		0.5 mm 以上 1060 mm 以下	2000-12-21	比較測定		
マイクロメータ (マイクロメータヘッドを含む)		500 mm 以下 (マイクロメータヘッドは 25 mm 以下)	2002-02-04	-		
ノギス		1000 mm 以下				
ハイトゲージ		1000 mm 以下				
デプスゲージ		1000 mm 以下				
ダイヤルゲージ校正器		100 mm 以下				
ダイヤルゲージ		100 mm 以下				
てこ式ダイヤルゲージ		1.6 mm 以下				
シリンダゲージ		6 mm 以上 400 mm 以下	2005-04-20			
電気マイクロメータ		±5 μm、±200 μm、 ±2000 μm				
リングゲージ	6 mm 以上 120 mm 以下					
球(平均直径)	2 mm 以上 40 mm 以下	2013-02-07	光波干渉測定 比較測定			
川崎 キャリブレーション センタ	ダイヤルゲージ校正器	インジケータ検査機 100 mm 以下	0086	2020-02-04	-	
広島 キャリブレーション センタ	ダイヤルゲージ	100 mm 以下	0109	2002-04-11	-	
	てこ式ダイヤルゲージ	1.6 mm 以下				
	ダイヤルゲージ校正器	25 mm 以下				
	ノギス	1000 mm 以下				
	ハイトゲージ	1000 mm 以下				
	マイクロメータ (マイクロメータヘッドを含む)	500 mm 以下 (マイクロメータヘッドは 25 mm 以下)				
	デプスゲージ	1000 mm 以下				2005-07-07
	各種長さ測定用校正器で 測定面が平面であるもの	25 mm 以上 1000 mm 以下				
	リングゲージ	6 mm 以上 120 mm 以下				
	指示マイクロメータ	マイクロメータ部：100 mm 以下 インジケータ部：±0.06 mm				2009-07-01
	表面性状	深さ：0.3 μm 以上 20 μm 以下				2017-08-03
		算術平均粗さ：0.1 μm 以上 5 μm 以下				
最大高さ粗さ：0.3 μm 以上 20 μm 以下						
テクノサービス 事業本部	座標測定機：現地校正 (画像測定機を含む)	10000 mm 以下 (画像測定機は 1000 mm 以下)	0186	2006-12-27	-	

## 2. 温度

	種類	校正の範囲	認定番号	初回認定日	備考
計量標準キャリブレーション課	抵抗温度計	0 °C 以上 40 °C 以下	0067	2018-08-30	比較校正
	指示計器付温度計				

## 3. 硬さ

	種類	校正の範囲	認定番号	初回認定日	備考
広島キャリブレーションセンタ	ロックウェル硬さ標準片	20 HRC 以上 65 HRC 以下	0109	2017-02-21	-
	ビッカース硬さ標準片	85 HV 以上 1050 HV 以下 (試験力 0.9807 N 以上 490.3 N 以下)			
テクノサービス 事業本部	ロックウェル硬さ試験機 (現地校正)	20 HRC 以上 65 HRC 以下	0186	2019-03-22	-
	ビッカース硬さ試験機 (現地校正)	85 HV 以上 1050 HV 以下 (試験力 0.9807 N 以上 490.4 N 以下)			

JCSS 認定機関：独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター (IAJapan/NITE)

・JCSS：計量法トレーサビリティ制度 (Japan Calibration Service System)

・IAJapan：認定センター (International Accreditation Japan)

・NITE：独立行政法人 製品評価技術基盤機構 (National Institute of Technology and Evaluation)